

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

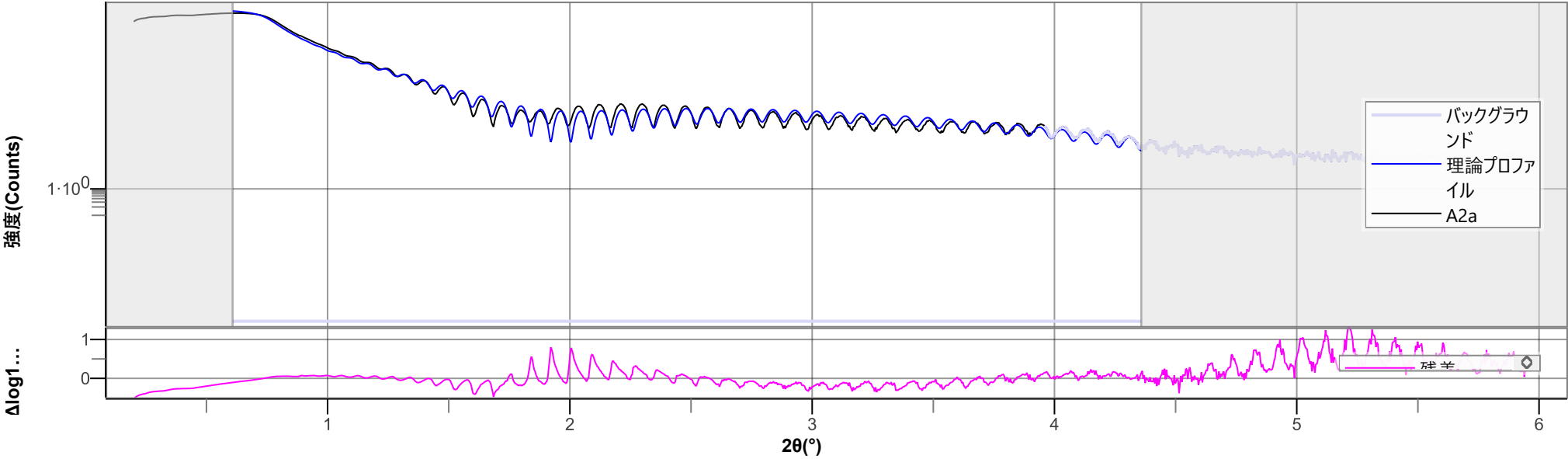
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg<		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe2O3	2.567	Const	4.95000	Const	0.446	Con...	
				±0.5	精密化	±0.04	→最大精密化	±0.013	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	92.402	Const	7.67174	Const	0.000	Con...	
				±0.06	精密化	±0.03	精密化	±0.05最小	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	